

ОПТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА В SbSI ВБЛИЗИ КРИТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ КИРИ

Е.И.Герзанич, В.М.Фридкин

В настоящее время имеется ряд экспериментальных результатов, позволяющих предполагать, что в SbSi вблизи температуры $T = -40^\circ\text{C}$ и давления $P = 1500 \text{ atm}$ имеет место выход линии фазовых переходов первого рода на линию фазовых переходов второго рода. К числу этих результатов относится ряд диэлектрических измерений. При приближении к указанной выше точке начинает выполняться закон "двойки", температурный гистерезис фазового перехода уменьшается до нуля, соответственно изменяется характер температурной зависимости спонтанной поляризации.

Известно, что наиболее характерной особенностью сегнетоэлектрического фазового перехода в SbSi, как перехода первого рода, является наличие структуры чередующихся фаз, наблюдаемых вблизи фазового перехода [1 – 3]. Ларкиным и Хмельницким [4] было показано, что температурный интервал сосуществования фаз (и соответственно оптического наблюдения полос) в SbSi в первом приближении линейно связан со скачком ширины запрещенной зоны кристалла при фазовом переходе.

В связи с отмеченным выше представляло интерес исследовать структуру полос в SbSi вблизи фазового перехода в том интервале давлений, в котором по предположению [5] имеет место выход линии фазовых переходов первого рода на линию фазовых переходов второго рода. Если в действительности тройная точка диаграммы состояний в SbSi ($P = 1500 \text{ kbar/cm}^2$, $T = 40^\circ\text{C}$) соответствует этому выходу, то по мере приближения к этой точке температурный интервал сосуществования фаз должен уменьшаться, а вблизи этой точки сама структура полос должна исчезать.

Исследуемый кристалл SbSi помещался в термостатируемую камеру высокого давления, конструкция которой описана в [6]. Камера позволяла производить визуальные наблюдения кристалла в проходящем монохроматическом свете при увеличении $25\times$. С скачком ширины запрещенной зоны при фазовом переходе определялся из температурной зависимости края собственного поглощения. В качестве источника монохроматического света использовался монохроматор УМ-2. Регистрация проходящего через кристалл света производилась с помощью фотоэлектронного умножителя ФЭУ-38.

На рис. 1 представлены микрофотографии кристалла, снятые в поляризованном свете вблизи фазового перехода и демонстрирующие обычную для SbSI структуру полос, с границами раздела фаз вдоль плоско-

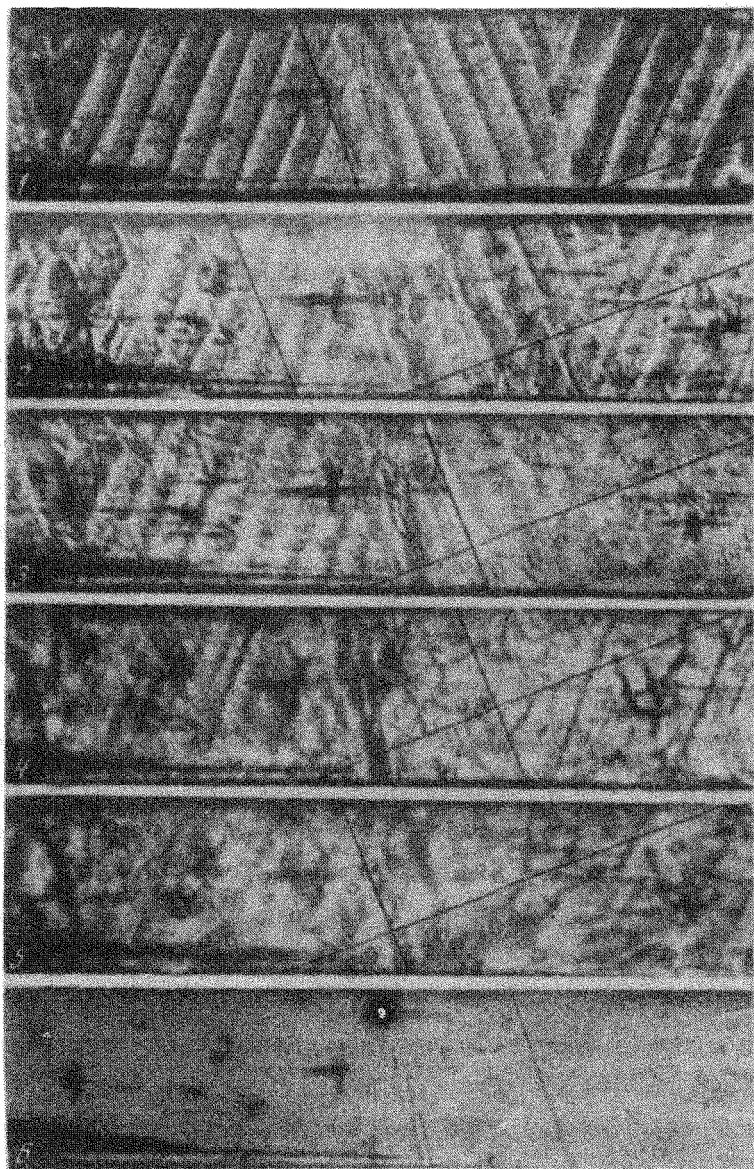


Рис. 1. Микрофотографии монокристалла SbSI при разных значениях гидростатического давления вблизи температуры фазового перехода: 1 – $P = 1$ атм, $T = 23^\circ\text{C}$; 2 – $P = 130$ атм, $T = 18,5^\circ\text{C}$; 3 – $P = 350$ атм, $T = 9^\circ\text{C}$; 4 – $P = 1000$ атм, $T = -18^\circ\text{C}$; 5 – $P = 1350$ атм, $T = -32,5^\circ\text{C}$; 6 – $P = 1500$ атм, $T = -40^\circ\text{C}$

ости (101). Шесть микрофотографий на рис. 1 соответствуют шести различным значениям давления в диапазоне от 1 до 1500 $\text{кг}/\text{см}^2$. На диа-

граммме состояния этим значениям давления соответствуют значения температуры Кюри интервале от $+23^{\circ}\text{C}$ до -40°C . Как и следовало ожидать, вблизи тройной точки, структура полос исчезает. При этом, как видно из рис. 1, ориентация межфазовых границ с давлением существенно не изменяется. Отдельные наблюдения показали, что с увеличением давления температурный интервал сосуществования фаз ΔT непрерывно уменьшается и вблизи тройной точки обращается в нуль.

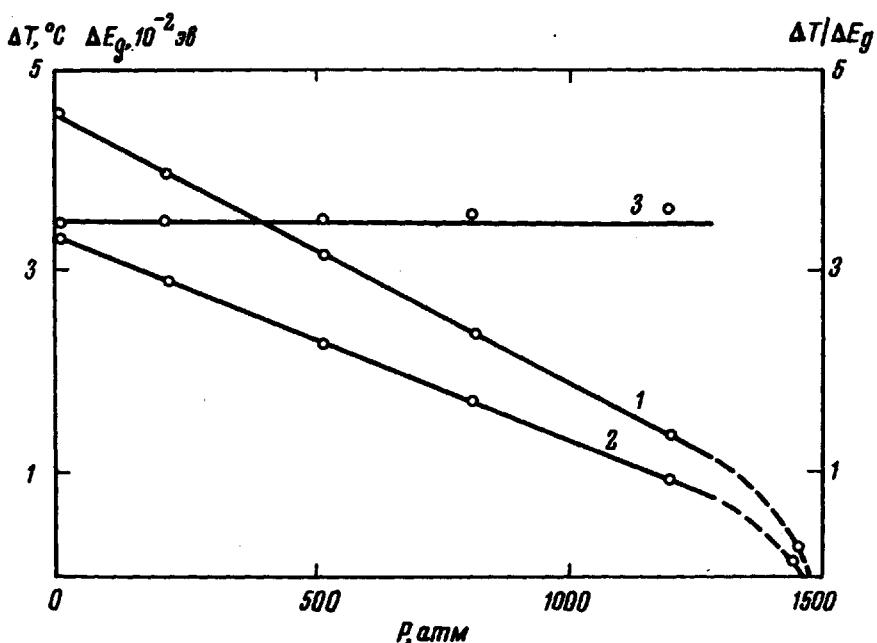


Рис. 2. 1 – зависимость от давления скачка ширины запрещенной зоны $\Delta E(g)$, 2 – температурного интервала сосуществования фаз ΔT и 3 – отношения $\Delta T/E_g$ для монокристаллов SbSI

Наряду с этими наблюдениями производились измерения скачка ширины запрещенной зоны ΔT при фазовом переходе в SbSI в диапазоне давлений от 1 до $1500 \text{ кг}/\text{см}^2$. На рис. 2 приведены зависимости от давления скачка ширины запрещенной зоны ΔE_g в электроновольтах, температурного интервала сосуществования фаз в $^{\circ}\text{C}$, а также отношения $\Delta T/\Delta E_g$ в относительных единицах. Из этих данных видно, что $\Delta T/\Delta E_g$ почти не изменяется с давлением, т.е. в соответствии с [4] между ΔT и ΔE_g имеет место линейная зависимость, причем коэффициент пропорциональности от давления не зависит.

Таким образом, как факт исчезновения межфазовых границ в SbSI вблизи тройной точки, так и обращение в нуль вблизи этой точки скач-

ка ширины запрещенной зоны, служит дополнительным подтверждением того, что при $T = -40^{\circ}\text{C}$ и $P = 1500 \text{ кг}/\text{см}^2$ для SbSI имеет место выход линии фазовых переходов первого рода на линию фазовых переходов второго рода.

Авторы признательны С.М.Стишову за цennую методическую помощь и Н.А.Тихомировой за обсуждение некоторых результатов настоящей работы.

Институт кристаллографии
Академии наук СССР

Поступило в редакцию
29 августа 1968 г.

Литература

- [1] А.А.Греков, В.А.Лиховицкая, А.И.Родин, В.М.Фридкин. ДАН СССР, 169, 810, 1966.
- [2] S. Kawada, M. Ida. J. Phys. Soc. Japan, 20, 1287, 1965.
- [3] T. Mori, H. Tamura, E. Sawaguchi. J. Phys. Soc. Japan, 20, 1294, 1965.
- [4] А.И.Ларкин, Д.Хмельницкий. ЖЭТФ, 55, вып. 12, 1968.
- [5] Е.И.Герзанич, В.М.Фридкин. ФТТ, 10, 3111, 1968.
- [6] Е.И.Герзанич, В.М.Фридкин. Кристаллография, 14, 1969, (в печати).